

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

по кандидатской диссертации Бойковой А.С. «Формирование тонкопленочных упорядоченных белковых структур из полидисперсных кристаллизационных растворов лизоцима»
по специальности 01.04.07 – «физика конденсированного состояния».

Фамилия, имя, отчество оппонента	Суворов Эрнест Витальевич
Дата рождения	07.11.1937
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	01.04.07 - физика конденсированного состояния
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук
Ученое звание	Профессор
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук
Почтовый адрес с указанием индекса	142432 Черноголовка, Московская обл., ул. Институтская, 2
Занимаемая должность	Главный научный сотрудник лаб. структурных исследований
Телефон	8-903-672-3851
Адрес электронной почты	suvorov@issp.ac.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<p>1. Э. В. Суворов, И. А. Смирнова, А. С. Образова Устройство для изгиба кристаллов в процессе рентгеновского эксперимента // <i>Приборы и техника эксперимента</i>, 2015, № 1, с. 178–180</p> <p>2. Э. В. Суворов, И. А. Смирнова, Дифракционное изображение дефектов в рентгеновской топографии (рентгеновской микроскопии), <i>УФН</i>, 2015, том 185, № 9, с. 897–915</p> <p>3. Э. В. Суворов, И. А. Смирнова, А. С. Образова устройство для изгиба кристаллов в процессе рентгеновского эксперимента // <i>Приборы и техника эксперимента</i>, 2015, № 1, с. 1–3</p> <p>4. Э.В. Суворов, И.А. Смирнова Новый высокочувствительный рентгеновский метод определения локальных деформаций поверхности кристаллов с помощью изгибных интерференционных полос // <i>Письма в ЖТФ</i>, 2016, том</p> <p>5. V. Asadchikov, A. Buzmakov, F. Chukhovskii, I. Dyachkova, D. Zolotov, A. Danilewsky, T. Baumbach, S. Bode, S. Haaga, D. Hañschke, M. Kabukcuoglu, M.</p>

Balzer, M. Casellee and E. Suvorov, X-ray topo-tomography studies of linear dislocations in silicon single crystals // *J. Appl. Cryst.* (2018). **51**, 1616–1622

6. Э. В. Суворов Рентгеновская топография: вчера, сегодня и перспективы // *Поверхность. рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования*, 2018, № 9, с. 3–22

7. Zolotov D.A., Asadchikov V.E., Buzmakov A.V., D'yachkova I.G., Krivonosov Y.S., Chukhovskii F.N., Suvorov E.V. X-ray Diffraction Tomography Using Laboratory Sources for Studying Single Dislocations in a Low Absorbing Silicon Single Crystal // *Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing*. 2019. V. 55. № 2. P. 126.

8. Золотов Д., Асадчиков В., Бузмаков А., Дьячков И., Кривонос Ю., Чуховский Ф., Суворов Э. Рентгеновская дифракционная томография с применением лабораторных источников для исследования одиночных дислокаций в слабо поглощающем монокристалле кремния // *Автометрия* 2019. т. 55, № 2, с.28-35

Д.ф.-м.н., проф. Суворов Э.В.

Попись Суворова Э.В. заверяю
Ученый секретарь кандидат физ.-мат. наук
Терещенко Алексей Николаевич

14 ноября 2019 г.

**УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ИФТ РАН
ТЕРЕЩЕНКО А.Н.**

